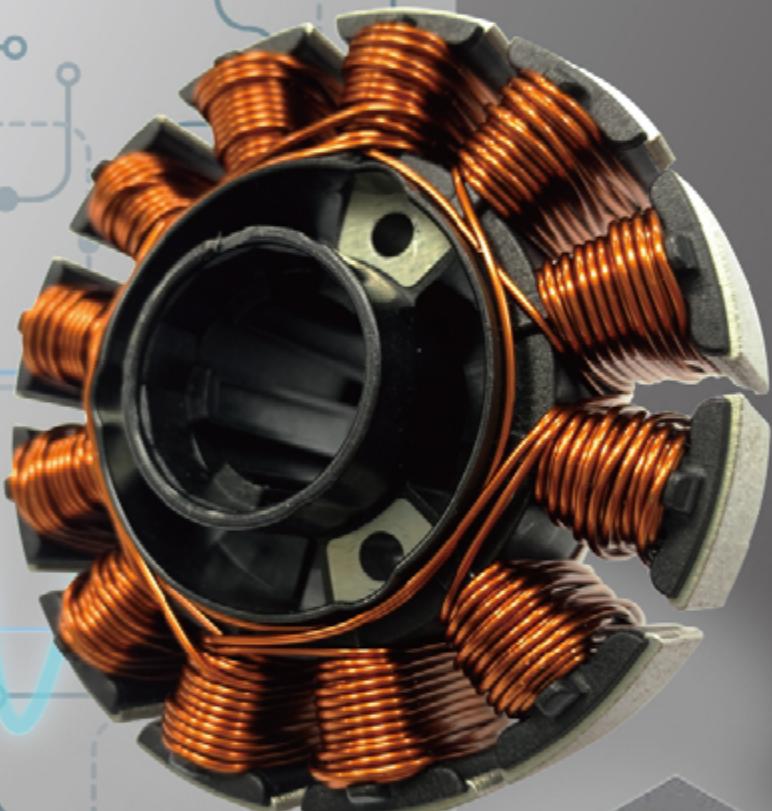


7750 Impulse Winding Tester

從層間短路測試
提昇繞線元件的絕緣可靠度



FILE: NONAME
VOLT: 250 kV
PASS: 17
HFLT: PASS 0
HARM: PASS



7750 VIDEO

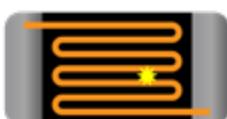
非破壞性脈衝高壓測量繞線元件，把關安規性能、提昇絕緣可靠度



漆包線破裂



漆包線沾錫



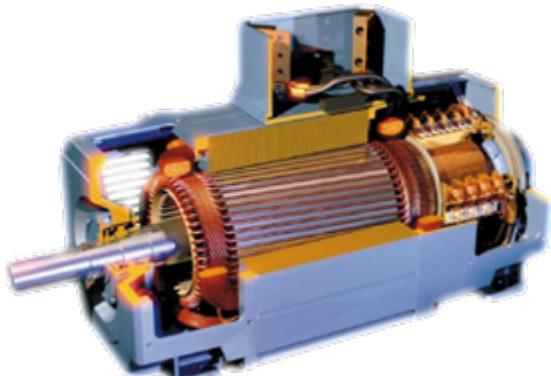
發燙 / 溫度性能變差



隨著新能源電動車、光伏儲能與電源技術提昇功率趨勢下，對於繞線元件 - 電感、變壓器與馬達的效能更苛求，像是更高的效率、更低的損耗，相對的繞線元件的安規絕緣品質成為關鍵的指標。

一般元件廠都會使用耐壓測試儀檢驗耐電壓與絕緣能力，往往忽略漆包線瑕疵造成的層間短路不良問題，對於漆包線刮傷、破裂處不完全短路的現象，耐壓測試儀雖然測試電壓很高但其測試頻率為 50/60Hz，施加於待測物線圈的兩端等同於短路狀態，是無法檢出層間短路不良品。

此外若用一般 LCR Meter 因量測電壓低，無法從電阻值、電容值與電感值找出明顯的異常，必須採用非破壞性脈衝高壓檢測技術，透過圖形分析檢視層間短路不良導致的細微放電現象，檢出不良品，把關繞線元件的可靠度。



當馬達繞組內有一部分線圈直接被短路無法發揮電感作用，與好的馬達相較下磁場不同、不對稱，也將會對剩餘的線圈電流變大，導致馬達運行中振動變大、電流增大，出力相對減少，時間一久可能出現雜音、發熱甚至燒毀。

電感	Inverter- 變壓器	馬達
<ul style="list-style-type: none">• 檢測層與層之間的短路• 檢測線與線之間的短路• 檢測絕緣瑕疵促成感量特性變低	<ul style="list-style-type: none">• 檢測高壓線圈跨槽不良• 檢測高壓線圈勾線問題• 檢測高壓線圈出線槽噴錫不良• 檢測高壓線圈折線不良• 檢測層與層之間的短路• 檢測線與線之間的短路	<ul style="list-style-type: none">• 檢測層間短路造成漏電問題• 檢測層間不良造成電弧次數• 檢測層與層之間的短路• 檢測線與線之間的短路

滿足高低感量繞線元件脈衝測試 超高速檢測 10 次 / 秒 自動化生產的最佳選擇



200V-10000V	$\geq 20\mu H$
100V-5200V	$\geq 1\mu H$
10V-1200V	$\geq 0.1\mu H$

線圈層間短路測試儀 7750 IMPULSE WINDING TESTER

USB HOST

USB Device

RS-232

Remote

LAN

GPIB

Option

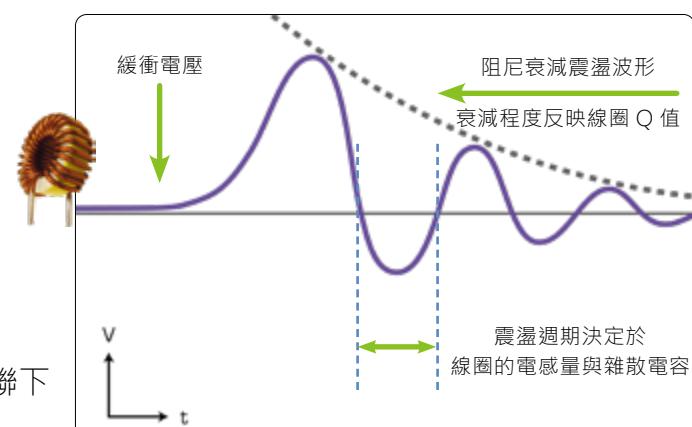
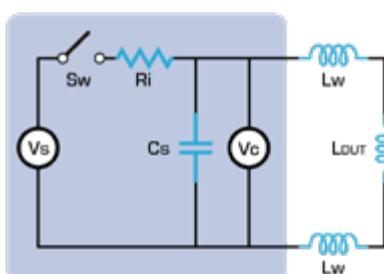
MICROTEST 7750 層間短路測試儀，提供高、低感量繞線元件的絕緣品質可靠性測試，採用非破壞性脈衝電壓進行波形取樣比對，有效檢測馬達、變壓器、BL 電感等自身絕緣不良的問題。分別支援 1200V/5200V/10000V 脈衝電壓輸出，採用 200MHz 高速取樣技術分析更細微的放電不良問題，提供 6 種分析比對模式，包含總面積比對、面積差比對、電暈數比對、顫抖數比對、二階微分比對與波形比對模式，測試速度高達 10 次 / 秒，為繞線元件生產自動線的最佳選擇。

選型	7750-5E	7750-5H	7750-5S	7750-1S	7750-10S
脈衝電壓	100V~5200V	100V~5200V	100V~5200V	10V~1200V	200V~10000V
電感值量測範圍	$\geq 16\mu H$	$\geq 4\mu H$	$\geq 1\mu H$	$\geq 0.1\mu H$	$\geq 20\mu H$
波形採樣率	50MHz/9 bit	100MHz/9 bit	200MHz/9 bit	200MHz/9 bit	200MHz/9 bit



7750 採用非破壞性高壓高速脈衝量測技術 200MHz 高速取樣阻尼衰減波形，有效檢出線圈短路絕緣不良

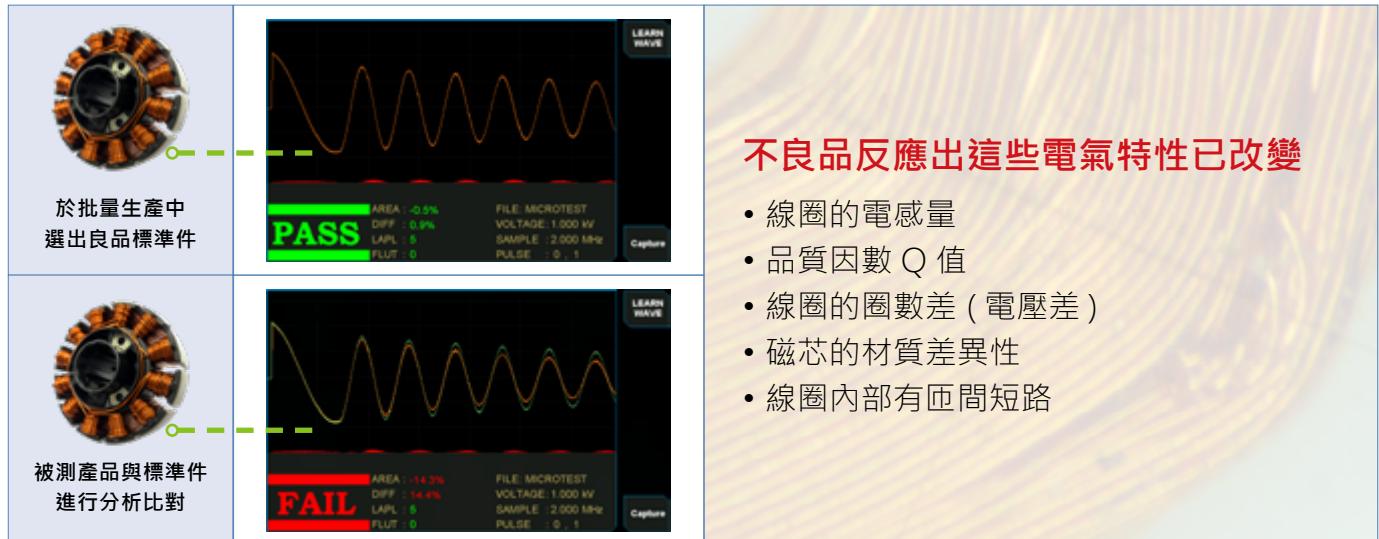
施加脈衝電壓於繞組線圈的兩端，在不破壞被測物的條件下，透過 L/C 諧振產生阻尼衰減振盪波形，進行標準品與被測物比對兩者間的瞬間波形，在產品壽命性品質下提前檢出層間短路、內部線圈或磁芯絕緣瑕疵的不良品。



- 透過儀器內部電容 C_s 與外部待測物電感 L_r 並聯下
- 儀器輸出一組高速脈衝壓于並聯線路上
- 產生電感 L / 電容 C 諧振

阻尼衰減波形進行比對分析

7750 層間短路測試儀嚴格把關繞線元件的可靠性測試 提早發現電極處焊接不良問題、繞組層間完全短路 / 不完全短路、磁芯絕緣不良



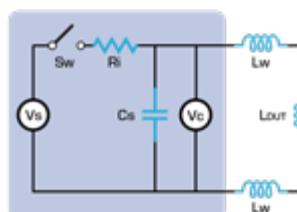
崩潰電壓分析功能



電壓爬升 % 可設定起始電壓的 1% (最小爬升步進)

MICROTEST 7750 支援崩潰電壓分析功能，可對繞線元件設定 1 起始電壓 2 結束電壓 3 起始電壓最小爬升 %，在二階微分與電量數比對模式下，判定是否超過設定的標準值，驗證測試此繞線元件可承受的耐電壓強度。

補償電壓功能



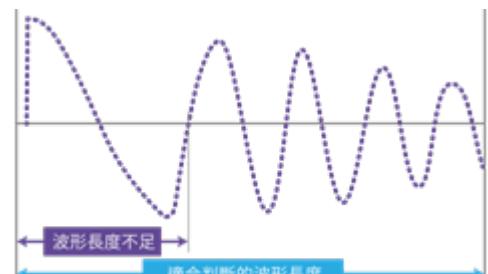
$$V_{DUT} \approx V_c \times \frac{L_{DUT}}{L_{DUT} + 2L_w}$$



提供實際輸出電壓檢視功能

為了降低自動線檢測時受過高的配線阻抗造成電壓分壓於測試線上，促使實際輸出的電壓低於設定的電壓值，造成漏檢不良品的品質疑慮，7750 支援電壓補償功能，提昇檢測精度與降低誤判的風險。

200MHz 高速採樣技術



200MHz 高速採樣技術，分析更細微放電所引起的瞬間變化

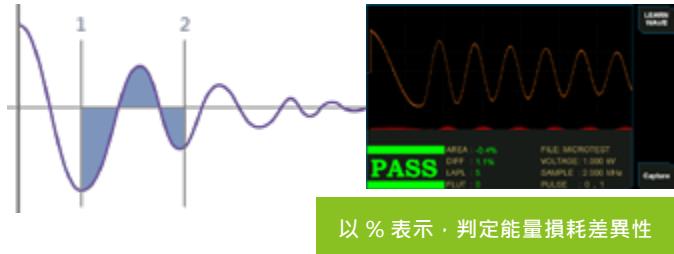
支援 6 種分析比對模式

分析檢出不同繞線元件的絕緣短路問題



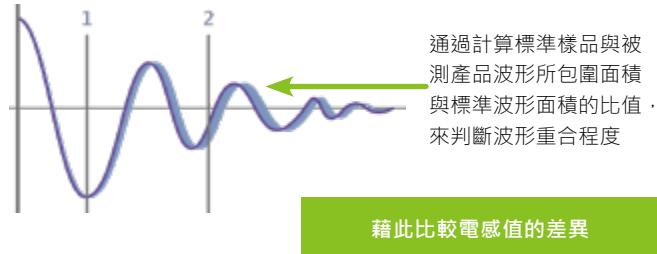
AREA 總面積比對模式

於下圖 1 至 2 範圍內進行待測線圈波形面積比對，當待測物發生層間短路時，由於線圈能量損耗增加，諧振阻尼係數變大，諧振振幅會變小，總面積跟著變小，是檢查層間短路最基本的參數。



DIFF 面積差比對模式

將標準樣品與待測產品兩者波形點對點面積之相異處加總則稱為「面積差」。當待測物發生匝間短路時，電感變小（類似變壓器次極圈短路時，初極圈電感會變小），造成後段波形振盪頻率發生變化，諧振波形相位改變，面積差隨之改變。

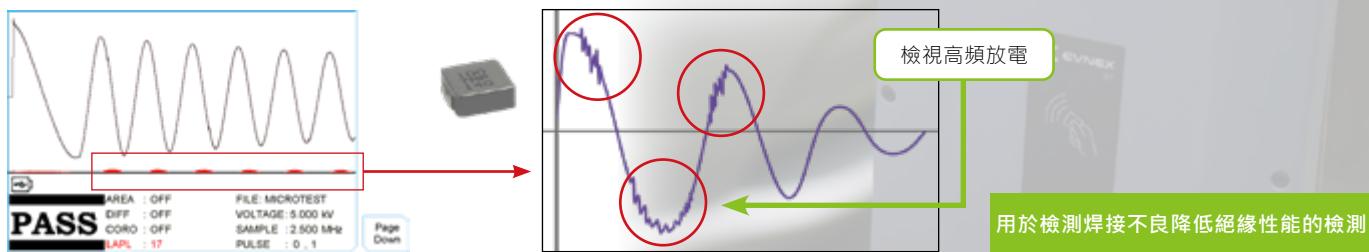


CORONA 電量數比對模式

繞組線圈於高壓脈衝測試中，自身絕緣系統損壞而產生尖端放電，透過波形顯示放電曲線中出現電量的現象，此功能可統計電量發生的次數根據其偏差程度進行判定。



LAPLACIAN 二階微分比對模式



線圈絕緣品質不良在高壓衝擊下產生放電，引起振盪波形產生快速的變化，透過 7750 二階微分演算獲得最高放電量，有效檢測一體成型電感因焊點不良造成漏電的品質問題。

COMP 波形比對模式



將標準波設定一可容許之波形範圍，此項目可同時判斷諧振波的振幅及相位，可加大匝間短路的檢出能力。

FLUT 顫抖數比對模式



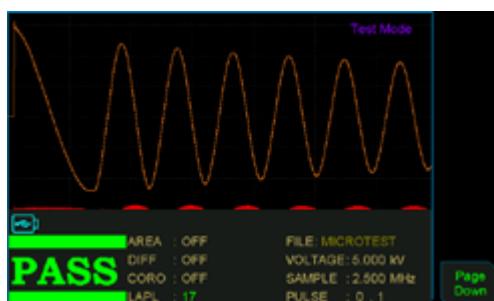
當繞組線圈有發生匝間放電的現象時，波形將產生顫抖，因此儀器將波形顫抖程度量化成數值進行比對。



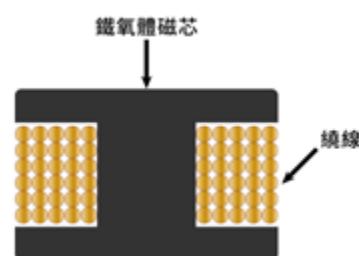
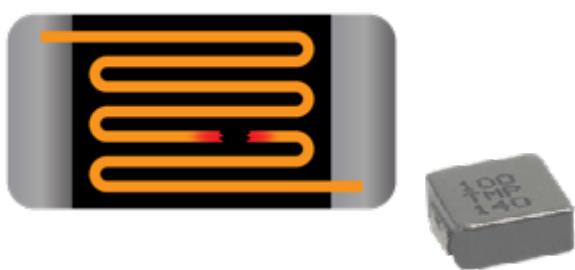
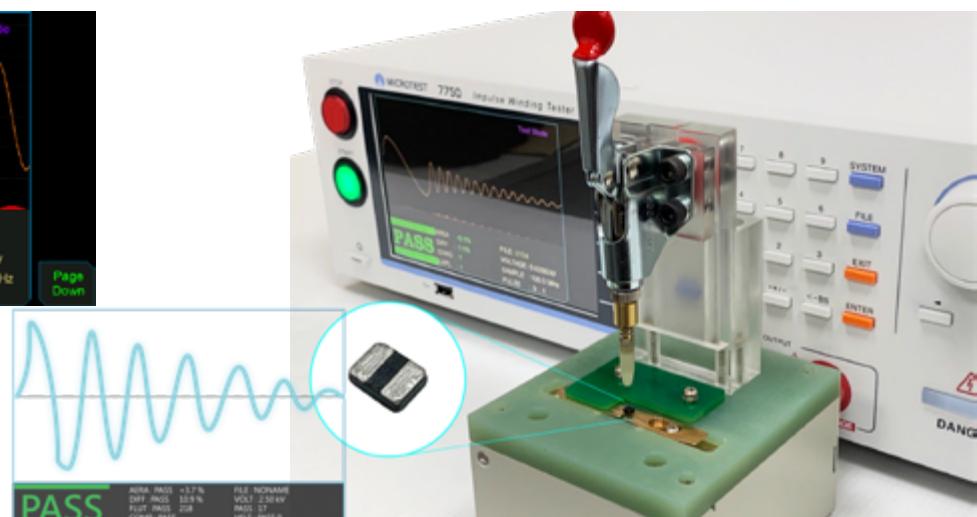
APPLICATION 選型測試方案

一體成型電感

一體成型電感最常用於 EV 電動機驅動電路中的能量儲存和濾波，為高頻的電流脈衝提供穩定的電源與抑制電磁干擾，在一體成型電感製程中容易受到導體材料或磁性粉末材料溢出到不應該存在的結構導致層間短路不良，或是導體材料本身電鍍不均勻，引起不正常的導電通路造成層間短路，透過 7750 二階微分演算獲得最高放電量，有效檢測一體成型電感因焊點不良造成漏電的品質問題。



二階微分比對模式

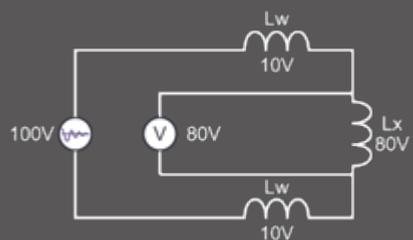


選型 | 7750-1S 低感量層間短路測試方案

儀器型號	7750-1S
治具型號	FX-IM0001
脈衝電壓	10V~1200V
電感量測範圍	$\geq 0.1\mu\text{H}$
波形採樣率	200MHz/ 9 bit
量測技術	四線式



FX-IM0001 | SMD 測試治具





APPLICATION 選型測試方案

繞線元件 - 馬達 / 變壓器

電源開關頻率不斷提高下，繞線元件在長期運行工作中，其內部絕緣不良或不完全短路的線圈範圍可能因瞬間高電壓 / 高電流發生了局部放電，促使馬達、變壓器等繞線元件自身的絕緣性能變差，長時間嚴重的局部放電下可能發生擊穿之危險，因此，在製程中若只有短時間的耐壓檢測流程是無法真正試驗繞線元件的可靠性能，故需要 7750 進行局部放電測試，利用非破壞性脈衝電壓，透過電感 L 與電容 C 諧振產生阻尼衰減波形，從圖形分析比對下檢出層間短路不良品。



高功率扼流圈



變壓器



電感



馬達定子 / 轉子線圈

層間短路：電流經過繞組一圈一圈的線圈中，線圈自身的漆包線材有瑕疵，電流行經時可能因瑕疵造成路徑縮短，產生跳電短路的不良。

選型 | 7750 層間短路測試方案

儀器型號	7750-5E	7750-5H	7750-5S	7750-10S
脈衝電壓	100V~5200V	100V~5200V	100V~5200V	200V~10000V
電感量測範圍	$\geq 16\mu\text{H}$	$\geq 4\mu\text{H}$	$\geq 1\mu\text{H}$	$\geq 20\mu\text{H}$
波形採樣率	50MHz/ 9 bit	100MHz/ 9 bit	200MHz/ 9 bit	200MHz/ 9 bit
產品應用	變壓器、馬達線圈			Inverter 變壓器、高壓點火線圈

線圈層間短路測試儀器

7750

特色

- 最小電感值 $\geq 0.1\mu\text{H}$
- 電壓補償功能
- 崩潰電壓測試
- 穩定高速測試：10 次 / 秒
- 高速脈衝取樣率
200MHz/9bits
- 可程式脈衝電壓測試
- USB Host 快速存取測試畫面
- 儀器內建可儲存 128 組測試
波形
- 六種波形分析模式，檢測繞
線元件層間短路不良



CE 標配 RS-232 | SIGNAL I/O | USB Host/Device

量測數據

型號	7750-1S	7750-1F	7750-5E	7750-5H	7750-5S	7750-10S
脈衝電壓	10V~1200V			100V~5200V		200V~10000V
電壓解析度	0.1V			1V		5V
電感量測範圍	$\geq 0.1\mu\text{H}$		$\geq 16\mu\text{H}$	$\geq 4\mu\text{H}$	$\geq 1\mu\text{H}$	$\geq 20\mu\text{H}$
脈衝能量	最大0.028焦耳			最大0.5焦耳		最大2焦耳
脈衝電壓精準度	$\pm (1\% \text{ of setting} + 5\text{V})$	$\pm [2\% \text{ of setting} \times (1+1\mu\text{H} / Lx) + 2\% \text{ of Range}]$		$\pm (1\% \text{ of setting} + 10\text{V})$		$\pm (1\% \text{ of setting} + 20\text{V})$
施加脈衝數	最大到32個					
輸入阻抗	20MΩ					
波形採樣率	200MHz/ 9 bit	50MHz/ 9 bit	100MHz/ 9 bit	200MHz/ 9 bit		
量測時間	10次/ 秒					
分析模式	AREA 總面積比對					
	DIFF 面積差比對					
	CORONA 電暈數比對					
	WAVEFORM 波形比對					
	FLUTTER 韻抖數					
	LAPLACIAN 二階微分	—	LAPLACIAN 二階微分			
崩潰電壓	●	●	—	—	●	●
統計功能	支援量測統計功能					

規格

SIGNAL I/O 輸入信號	START/ STOP
SIGNAL I/O 輸出信號	PASS/ FAIL/ TEST/ READY/ HV ON
安全開關	設置INTER LOCK功能，測試時需將安全開關進行短路，機台方能輸出脈衝電壓
內建儲存	128組
介面	RS-232、SIGNAL I/O、USB Host/ Device (GPIB選配)
電源需求	電壓：100Vac~240Vac、頻率：47~63Hz
消耗功率	70VA
液晶螢幕	7吋TFT，彩色顯示(800*480)
操作環境	溫度：0°C~40°C、濕度：20~80%RH
外觀尺寸(W*H*D)	430x132x370 mm(W*H*D)
重量	7Kg

7750 標準配件

- 電源線
- 2 端點高壓端子測試
- SIGNAL I/O 插頭

7750 選購相關項目

- RS-232 連接線
- 遠端控制線
- GPIB 介面
- 四線式 SMD 元件測試治具 (FX-IM0001)
- 電腦連線軟體